

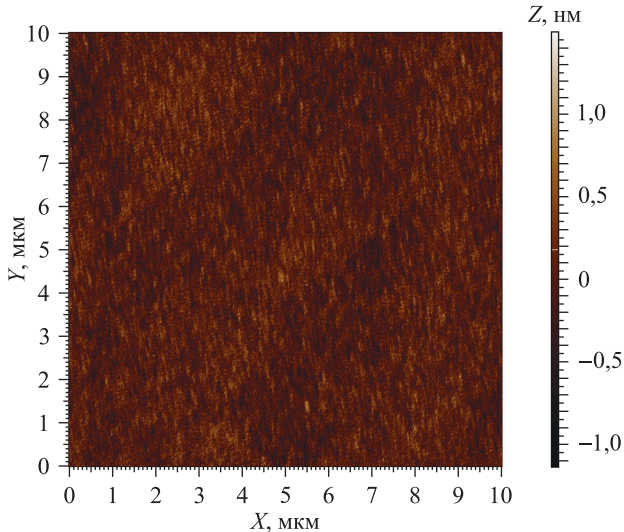


Рис. 6. Снимок поверхности пленки SiN_x ,
полученный с помощью атомно-силовой микроскопии

Fig. 6. Image of the SiN_x film surface obtained using atomic force microscopy